ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО Том 95 ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА 1958

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ В КРИСТАЛЛАХ С НЕИЗОМОРФНЫМИ ПРИМЕСЯМИ В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ЧАСТОТ

Г. И. ПОТАХОВА

(Представлено членом-корреспондентом АН СССР В. Д. Кузнецовым)

Известно, что при введении небольших количеств примеси в щелочно-галоидные кристаллы меняются их механические характеристики [1]. При введении примесей значительно изменяется электропроводность кристаллов [2, 3]. Хиппель [4] отмечает большое влияние малых примесей на электрическую прочность кристаллов. Ю. А. Сикорский указывает на увеличение диэлектрической проницаемости кристаллов каменной соли, содержащих коллоидальные красящие центры [5]. В целом ряде работ сообщаются результаты исследования влияния примесей на диэлектрические потери в щелочно-галоидных кристаллах. Но эти исследования проводились в основном в области невысоких частот $(10^1 - 10^5 г \mu)$ [6-10].

Эта работа, являясь продолжением проводимых в лаборатории электрофизики СФТИ исследований диэлектрических свойств простых и сложных кристаллов, рассматривает влияние неизоморфных примесей на диэлектрические потери щелочно-галоидных кристаллов в области высоких частот.

Были рассмотрены кристаллы NaCl и KCl с примесями CaCl₂, BaCl₂ и MgCl₂.

Примеси вводили в расплав, из которого выращивали кристалл по методу Киропулоса [1]. Концентрацию примеси в исследуемых кристаллах определяли методом количественного химического анализа [11]. Концентрация примеси в кристаллах была много меньше концентрации примеси в расплаве, из которого выращивали кристалл, что находится в согласии с данными других авторов [12].

Кроме химического был проведен спектральный анализ кристаллов, как содержащих примеси, так и без них. В результате спектрального анализа обнаружены следы примеси меди в кристаллах NaCl и кальция в кристаллах КCl. В кристаллах с примесями, кроме тех примесей, которые были специально введены в расплав, обнаружены лишь те же примеси, которые найдены в соответствующих им "чистых" кристаллах NaCl и KCl.

С целью выяснения влияния примесей на структуру исследуемых кристаллов были проведены рентгенографические и оптические исследования их.

Рентгенографически определяли постоянную кристаллической решетки исследуемых кристаллов и не обнаружили изменения параметров кристаллической решетки кристаллов с примесями по сравнению с параметрами решеток кристаллов, не содержащих примесей.

Значения постоянных кристаллических решеток кристаллов, содержащих наибольшее количество примесей, отличались от постоянных кристаллических решеток соответствующих им кристаллов без

примесей не больше, чем на 0,002 А, что лежит в пределах погрешности используемого метода. Эти результаты находятся в соответствии с данными Гловера [13], проводившего измерения параметров кристаллической решетки кристаллов КСІ, как содержащих примеси, так и без примесей, в интервале температур 20-- 600°С.

Исследуя кристаллы NaCl с наибольшей концентрацией примеси CaCl₂ методом Лауэ, получили типичную для монокристалла лауэграмму.

Проведенное Мияки и Суцзуки [14] методом вращения кристалла рентгенографическое исследование сплавов NaCl—CaCl₂ позволило им обнаружить изменение диффракционной картины за счет введения в NaCl примеси CaCl₂. Учитывая результаты различных авторов, проводивших исследование структуры сплавов NaCl—CaCl₂, можем сделать следующее заключение относительно структуры исследованных нами кристаллов NaCl, содержащих примесь CaCl₂: исследуемые кристаллы NaCl—CaCl₂ представляют собой монокристаллы со структурой NaCl, в плоскостях [III] и [310] которой располагается примесь тонкие пластинки со структурой, подобной структуре CaCl₂, состоящие из Ca⁺⁺, Cl⁻ и вакантных узлов Na⁺.

В литературе нет данных о структуре сплавов КСІ с примесью CaCl₂, BaCl₂ и MgCl₃ в области малых концентраций этих примесей. Проведенные нами рентгеновские исследования не обнаруживают присутствия примесей в рассматриваемых кристаллах. Поэтому были проведены дополнительные исследования кристаллов с примесями иммерсионным методом.

В результате исследования иммерсионным методом кристаллов KCl, содержащих примесь CaCl₂, обнаружено существование двух фаз, коэффициент преломления одной из которых равен коэффициенту преломления KCl; коэффициент преломления второй фазы отличается от коэффициента преломления KCl и CaCl₂. Подобные результаты получены и при исследовании сплавов KCl—MgCl₂.

Учитывая эти результаты и данные других авторов [15], проводивших исследования структуры сплавов KCl—CaCl₂ и KCl—MgCl₂ в областях, более богатых CaCl₂ и MgCl₂, можем предполагать, что исследованные нами кристаллы KCl с примесью CaCl₂ и MgCl₂ представляют собой монокристаллы KCl (об этом говорят рентгенограммы всех кристаллов KCl с соответствующими примесями), в которые в виде примеси входит вторая фаза, отличная от фаз вводимых примесей. Образование твердых растворов, которые бы могли быть этой второй фазой, отвергается литературными данными и является маловероятным вследствие большого различия ионных радиусов калия, кальция и магния.

Диэлектрические потери кристаллов с примесями измерены в интервале частот 3.10⁵—10⁸ ги при различных температурах резонансным методом изменения сопротивления.

Состав исследованных образцов и величина угла потерь в них при комнатной температуре и частоте 10⁶ гц приведены в таблице 1.

Таблица 1

Состав кристаллов		Состав кристаллов	
	tgð 104 f=106 ru		tgd . 104 f=10624
NaCl	0,64	КС1 + 0,03 мол % MgCl ₂	0,84
NaCl+0,03 мол % CaCl ₂	0,64	КСІ + 0,13 мол % MgCl ₂	0,89
N aCl+0,10 мол % CaCl ₂	1,20	$KCl + 0,55$ мол % $MgCl_2$	1,79
NaCl+1,6 мол % CaCl ₂	2,30	КСІ + 0,003 мол % СаСІ ₂	0,84
KC1	0,84	КСІ + 0,03 мол % CaCl ₂	0,90
КСІ- <u> </u> -0,12 мол % BaCl ₂	0,88	КС1 + 0,11 мол % СаСl ₂	1,20
КСІ + 0,40 мол % BaCl ₂	1,68	КСІ + 0,40 мол % СаСІ ₂	7,25
КС1 + 0,59 мол % BaCl ₂	2,32	КС1 + 0,85 мол % CaCl ₂	14,50
		КС1 + 0,99 мол % CaCl ₂	2 3,1 0
			1

Концентрация примеси в кристаллах определялась с точностью до 0,01 мол ⁰/₀. Состав кристаллов, содержащих только тысячные и сотые доли молекулярного процента примеси, приводится по данным синтеза, концентрация примеси в них химическим анализом не определялась. Как ясно из приведенных в таблице данных, наибольшее изменение угла потерь из всех рассматриваемых примесей вызывает примесь CaCl₂. Видно также, что относительное изменение угла потерь растет по мере увеличения концентрации примеси.

Частотные зависимости угла потерь в кристаллах с примесями приведены на фиг. 1, 2, 3.



Фиг. 1. Частотные зависимости угла потерь в кристаллах NaCl с примесью CaCl₂ 1. NaCl. 2. NaCl+0,11M% CaCl₂, 3. NaCl+4,6M% CaCl₂

Как видно из фигур, при уменьшении частоты наблюдается увеличение угла потерь во всех кристаллах. Это увеличение тем значительнее, чем больше концентрация примеси. Из фиг. 1—3 видно, что примеси значительнее влияют на величину угла потерь в области низких частот: в кристаллах NaCl с примесью CaCl₂ всех исследованных концентраций углы потерь при частотах $3^{\circ}10^{6}$ — 10^{7} гц отличаются очень незначительно (в 1,5—2 раза), а при частоте 10^{6} и $3^{\circ}10^{5}$ гц угол потерь в NaCl + 1.6 мол $^{0}/_{0}$ CaCl₂ уже примерно в 4 раза больше угла потерь в NaCl.

Как и при частоте внешнего электрического поля 10⁶ ги, во всем исследованном интервале частот наиболее сильное изменение угла

19. Изв. ТИИ, т. 95.

потерь наблюдается при введении примеси $CaCl_2$. Сравнивая изменение угла потерь при введении примесей $CaCl_2$ в NaCl и KCl, можно отметить, что значительнее увеличивается угол потерь при введении $CaCl_2$ в KCl, чем в NaCl. Особенно это проявляется при наибольших концентрациях примеси $CaCl_2$. Введение примеси $CaCl_2$ —0,10 мол $^{0}/_{0}$ вызывает примерно одинаковое изменение угла потерь в NaCl и в KCl, а при введении примеси порядка одного процента угол потерь в NaCl—CaCl₂ увеличивается примерно в 5 раз по сравнению с углом потерь в NaCl, а в KCl—CaCl₂—почти в 30 раз по сравнению с KCl (на частоте 3. 10^5 гц).



Фиг. 2. Частотные зависимости угла потерь в кристаллах KCl с примесями CaCl₂ различных концентраций. 1. KCl. 2. KCl + 0,11M% CaCl₂. 3. KCl + 0.40M% CaCl₂.



Фиг. 3. Частотные зависимости угла потерь в кристаллах КСІ с примесями MgCl. 1. КСІ и КСІ + 0,03М% MgCl₂. 2. КСІ + 0,13М% MgCl₂. 3. КСІ + 0,55М% MgCl₂.

При введении в KCl примесей BaCl₂ и MgCl₂ наблюдается заметное возрастание угла лишь при концентрациях примесей порядка нескольких десятых молекулярного процента. Примеси BaCl₂ и MgCl₂ в количествах примерно одной десятой молекулярного процента при комнатной температуре практически не изменяют угол потерь во всем исследованном интервале частот.

.

При повышении температуры становится заметным влияние малых примесей на величины угла потерь. На фиг. 4 приводятся типичные температурные зависимости кристаллов КСІ с примесью различных концентраций. Если угол потерь в кристаллах КСІ + 0,12 мол % BaCl, и в КСІ при комнатной температуре примерно одинаков, то по мере повышения температуры свыше 160°С угол потерь в КСІ +

+0,12 мол $^{0}/_{0}$ BaCl₂ становится заметно больше угла потерь в КСІ при этих температурах. Чем выше температура, тем значительнее угол потерь в кристалле с BaCl₂ превышает угол потерь в КСІ. Подобные закономерности имеют место и для кристаллов КСІ с другими примесями (CaCl₂ и MgCl₂). Если сотые и тысячные доли молекулярного процента примеси не изменяют угла потерь в кристаллах при комнатных температурах, то они изменяют температурные зависимости угла потерь в этих кристаллах, отличаясь более ранним и более резким возрастанием угла потерь при повышении температуры, чем подобные зависимости для простых кристаллов (фиг. 5).

Температурные зависимости угла потерь в кристаллах с примесями CaCl₂, BaCl₂ и MgCl₂ подобны температурным зависимостям угла потерь в простых кристаллах и в кристаллах с изо-



Фиг. 4. Температурные зависимости угла потерь в кристаллах KCl, содержащих различные количества примеси BaCl₂ на частоте 10⁵ ги. 1. KCl₁. 2. KCl + 0,12M % BaCl₂. 3. KCl + 0,40M % BaCl₂.

морфной примесью: в некотором интервале температур угол потерь мало зависит от температуры, а затем резко возрастает. Температура, выше которой наблюдается резкое возрастание угла потерь при даль-





3. KC1 ± 0.40 M% BaCl₂.

нейшем повышении температуры, зависит как от концентрации примеси, так и от частоты внешнего электрического поля. Чем больше концентрация примеси и ниже частота электрического поля, тем при более низкой температуре наблюдается резкое возрастание угла потерь (фиг. 6).

Для выяснения роли проводимости в процессе потерь энергии в кристаллах с примесями была измерена проводимость некоторых



кристаллов с примесями. В таблице 2 приводятся значения угла потерь, непосредственно измеренного и вычисленного по измерению проводимости этих же кристаллов.

Таблица 2

T ^o C	$\mathrm{KCl} + 0, 12 0_0 \mathrm{BaCl}_2$		TOC	KCI + 0,003 % CaCl ₂	
	f= tgo измер.	106 <i>гц</i> tgd вычисл. по с		f == tgo измер.	10 ⁶ гц tgd вычисл. по з
56	0.80.10-4	10 ⁻⁷	100	0,84.10-4	6,45.10 ⁻⁷
124	0,80.10-4	9.10 ⁻⁷	130	1.20.10-4	9 ,3.10 ⁶
170	1,00.10-4	6 .10 ⁻⁵	180	4,4.10-4	2 .10 ⁻⁴
2 00	$5.8, 10^{-4}$	1,81.10-4	200	10.10-4	6.10-1
210	9.10^{-4}	3,7.10-4			
240	21.10^{-4}	11,0.10-4			

Как видно из рассмотрения таблицы 2, угол потерь в исследованных кристаллах лишь при температурах 180—200°С становится равным по порядку величины углу потерь, рассчитанному по проводимости.

Все зависимости угла потерь в исследованных кристаллах с примесями аналогичны подобным зависимостям угла потерь в простых. кристаллах, отличаясь лишь более резким возрастанием угла потерь при уменьшении частоты и более ранним значительным ростом tg д при увеличении температуры. Отсюда можно сделать вывод, что механизм потерь в простых кристаллах, в которые специально не вводилась примесь, и в кристаллах с примесью одинаков. Увеличение угла потерь в кристаллах при введении в них примесей объясняется тем, что примесь искажает кристаллическую решетку, облегчая диссоциацию ионов, увеличивая число свободных и слабо связанных ионов. Более резкое возрастание угла потерь в кристаллах с примесями при уменьшении частоты и увеличении температуры говорит о большей роли проводимости в кристаллах с примесями по сравнению с кристаллами, в которые примесь специально не вводили. Если учесть работы по влиянию примесей на электропроводность кристаллов [2-3], то это вполне понятно.

Энергия освобождения ионов в кристаллической решетке при наличии в ней примесей уменьшается. Как указывает Френкель [16], чем больше отличаются ионы примеси и ионы основного вещества, тем сильнее уменьшается энергия разрыхления кристалла. Из рассмотренных кристаллов КСІ и NaCl с примесью CaCl₂ наибольшее изменение угла потерь под влиянием введения примеси наблюдается для кристаллов КСІ. Вероятно, примесь CaCl₂ больше разрушает решетку КСІ, чем NaCl. Это находится в соответствии с положением Френкеля о влиянии величины иона примеси на уменьшение энергии разрыхления решетки кристалла: ионные радиусы Ca⁺⁺ [1,06 \div 0,99Å] и Na⁺ [0,98 \div 0,95 Å] более близкие, чем радиусы Ca⁺⁺ (1,06 Å) и K⁺ [1,22 \div 1,35 Å], поэтому понятно, что Ca⁺⁺ сильнее разрушает решетку КСІ.

Структурные исследования также подтверждают предположение о большем разрушении примесью CaCl₂ решетки KCl, чем NaCl. Как отмечается в литературе [15], KCl с примесью CaCl₂ не дает твердых растворов, NaCl при малых концентрациях CaCl₂ образует с этой примесью твердые растворы, а образующаяся при больших концентрациях CaCl₂ в NaCl вторая фаза имеет много общего со структурой NaCl, а поэтому меньше ее искажает.

Большее изменение угла потерь в КСІ при введении CaCl₂, чем $BaCl_2$, также можно объяснить большим уменьшением энергии разрыхления КСІ примесными ионами Ca⁺⁺, чем ионами Ba⁺⁺. Ионные радиусы Ba⁺⁺ [1,43 \div 1,35 Å] и K⁺ [1,33 \div 1,35 Å] близки, что способствует образованию в некоторой области концентраций BaCl₂ твердых растворов КСІ — BaCl₂ с избытком компоненты КСІ, поэтому искажение решетки КСІ примесью BaCl₂ будет меньше, чем примесью CaCl₂.

Малое влияние на изменение угла потерь оказывает примесь $MgCl_2$, введенная в KCl. Ионный радиус Mg^{++} [0,78 \div 0,65 Å] значительно отличается от радиуса K⁺, что должно бы способствовать значительному изменению энергии разрыхления решетки KCl, в соответствии с положением Френкеля. Но этого не наблюдается. Возможно, малое влияние примеси MgCl₂ на изменение угла потерь в KCl связано с тем, что радиус ионов Mg⁺⁺ очень невелик, и они распределяются в решетке KCl, не вызывая больших искажений в ней.

В литературе приводятся результаты исследования диэлектрических потерь в кристаллах с примесями, но измерения потерь проведены в области невысоких частот [10¹ — 10⁵ ги]. Температурные зависимости угла потерь кристаллов с примесями, полученные Брекенриджем и Вильке, на частоте $\sim 10^3$ ги представляют собой кривые с максимумами [6, 8].

Частотные зависимости угла потерь кристаллов NaCl с примесямя CaCl₂ при различных температурах также имеют максимумы, смещающиеся при увеличении температуры в сторону более высоких частот. Такие же закономерности изменения угла потерь при изменении частоты и температуры обнаружены и при изучении аддитивно окрашенных кристаллов KBr [9].

При исследовании угла потерь рассматриваемых в данной работе кристаллов KCl и NaCl с примесями CaCl₂, MgCl₂ в исследованном интервале частот [$3 \cdot 10^5 \div 10^8 z \mu$] и температур [$20 \div 200^\circ$ C] не обнаружено максимумов угла потерь ни в частотных, ни в температурных зависимостях. Вероятно, это связано с тем, что наблюдаемые в области низких частот в температурных зависимостях угла потерь кристаллов с примесями максимумы tgd в области высоких частот будут проявляться при более высоких температурах, где исследование не было проведено. Действительно, в работе Суита [10], проводившего измерения на 3 *мгги*, обнаружен максимум tgd в зависимости от температуры при температурах свыше 300°C. Но работа Суита вызывает сомнение тем, что даже при температуре 100°C угол потерь в кристаллах NaCl у него получается гораздо больше, чем по данным других авторов [6, 7].

Заключение

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

1. Температурные и частотные зависимости угла потерь в кристаллах, содержащих примеси, подобны аналогичным зависимостям угла потерь в простых кристаллах, что позволяет предполагать одинаковый механизм потерь в простых кристаллах и кристаллах, содержащих примеси.

2. Увеличение угла потерь в кристаллах с примесями связано с разрыхлением примесью кристаллической решетки, снижением энергии активации и диссоциации ионов кристаллической решетки, что способствует увеличению числа свободных и слабо связанных ионов.

В этой работе по выяснению влияния примесей на диэлектрические потери и структуру кристаллов принимала участие студентка Г. Ф. Ярушевская [17].

ЛИТЕРАТУРА

1. Кузнецов В. Д. Физика твердого тела, т. II, стр. 127, 1941.

2. Lehfeldt. Zs. f. Physik. Об электропроводности кристаллов 85, 717, 1933. 3. Wagner, Hantelmann. J. Chem. Phys. Определение концентрации вакантных мест катионов и анионов в КСІ. 19, 213, 1951.

4. Нірреl. Электрическая прочность щелочно-галоидных кристаллов и изменение ее в смешанных кристаллах и при введении примесных ионов. Zs. f. Physik. 88, 358, 1934.

5. Сикорский Ю. А. Влияние нарушений кристаллической решетки на лиэлектрическую проницаемость каменной соли. ЖТФ, т. 26, в. П. 2487, 1956.

6. В reckenridge. Низкочастотная дисперсия в ионных кристаллах, содержащих посторонние ионы J. Chem Phys. 18, 913, 1950.

7. На v е п. Диэлектрические потери в кристаллах хлористого натрия J. Chem. Phys. 21, 171, 1953.

8. Wilke. Об измерении угла потерь в AgBr. Arbeitstagung Festkophysik IIт. 3, 1954.

9. Јасоbs. Диэлектрическая релаксация в кристаллах NaCi. "Naturwissenschaft" 42, 21, 575, 1955.

10. Suita. Диэлектрические свойства окрашенных кристаллов КСІ. Phys. Rev 94, 1497 - 1954.

11. Алексеевский В. В. и др. Количественный химический анализ стр. 89 — 109, 1948.

12. Watson, Scott. Определение кальция в щелочно-галондных кристаллах. J. Chem. Phys. 24, № 3, 1956.

13. Glover. Расширение решетки монокристаллов между 20 и 600°С. Zs. f.

13. Сточет. Расширение решетки лопокристанног нени.
Physik, I38, 222 — 236, 1954.
14. Міуаке. Рентгенографическое изучение структуры твердых растворов
Phys. Soc. Japan. 9, № 5, 702, 1954.
15. Громаков С. Д. и Громакова М. И. К вопросу об обработке кривых ликвидуса бинарных систем ЖФХ, т. 29, в. 4, стр. 745, 1955.
16. Фронковска Я. И. Кинетическая теория жидкости. АН СССР, 1945.

16. Френкель Я. И. Кинетическая теория жидкости, АН СССР, 1945. 17. Ярушевская Г. Ф. Дипломная работа. Томск, СФТИ, лаборатория электрофизики, 1956.